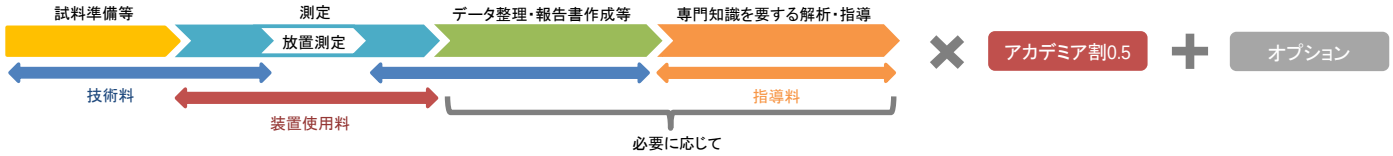
受託試験料金表
産学官金連携機構 設備共用部門の設備

（2024年4月）

受託試験料金は、(装置使用料＋技術料＋一般指導料＋高度指導料)×アカデミア割＋オプション料 で計算されます。
アカデミア割：論文や学会等での発表を目的とした大学・国立研究開発法人等の利用で、発表の際、謝辞等に担当者名や本学名を記載頂ける場合、5割引の料金となります。
ご依頼方法は https://kiki.web.nitech.ac.jp/gakugai/ から御覧ください。

料金区分	説明	料金単価（税込）
装置使用料	装置の使用時間に対する料金	下表のとおり
技術料	試料調製・測定(放置測定を除く)・作業レベルの簡単な解析・データ整理・報告書作成等の時間に対する料金	8,800円/時間
一般指導料	材料学的な知見等を要する解析や試験結果をもとにした改善案の提案等の指導時間に対する料金 同分野の専門家であれば一般的なレベルのもの	28,600円/時間
高度指導料	材料学的な知見等を要する解析や試験結果をもとにした改善案の提案等の指導時間に対する料金 担当教員が特に知見を有しており他の専門家では指導が難しいレベルのもの	42,900円/時間
オプション料	測定で特別に必要となる消耗品の料金 （低温測定用の液体窒素、試料調製用の重溶媒など）	実費から計算



測定室名	装置名、型式	性能・機能	装置使用料単価（税込）
物理・表面計測系			
透過型電子顕微鏡室Ⅰ	TEM (JEM-2100Plus)	加速電圧：80～200 kV、STEM、EDS、ハイコントラスト仕様	16,500円/時間
	方位解析システム (ASTER)	TEM (JEM-2100Plus)またはFE-TEM (JEM-2100F)で利用可能	11,000円/時間 ※別途TEM本体の装置使用料が発生します
透過型電子顕微鏡室Ⅱ	FE-TEM (JEM-2100F)	加速電圧：200 kV、STEM、EDS、EELS	23,100円/時間
	イオンスライサ (EM-09100IS)	傾斜角：最大±6 エッチングレート：5 mm/min（Si換算）	5,500円/時間
	精密イオンポリシングシステム (PIPS2 Model 695)	Ar+ イオンビーム	5,500円/時間
透過型電子顕微鏡室Ⅲ	3D-TEM (JEM-z2500)	エネルギー分散形X線元素分析装置付き 加速電圧：200 kV、格子像分解能：0.1 nm	29,700円/時間
	局所熱分析装置 (Nano-TA, VESTA)	分解能（高）、測定範囲：>100 nm、150 μm x 150 μm 分解能（低）、測定範囲：>1.5 μm、12 mm x 8 mm	11,000円/時間 ※プローブは別途利用者負担
	ウルトラミクロトーム (Leica EM UC7, FC7)	切削ウィンドウ：0.2-14 mm、切削スピード：0.05-100 mm/s、 切片の厚さ：0-15000 nm	5,500円/時間
	凍結試料作製装置 (EM-19500 JFDⅡ)	真空度：5x10^{-5} Pa以下、温度制御：+40～-170℃ 試料傾斜角度：0～90°、蒸着材料：Pt-C、C	5,500円/時間
	TEM (JEM-1400Plus)	加速電圧：100 kV 格子像分解能：0.2 nm	12,100円/時間
透過型電子顕微鏡室Ⅳ	TEM (JEM-2100)	加速電圧：200 kV、分解能：0.23 nm	12,100円/時間
	複合ビーム加工観察装置 (JIB-4500)	SIM像とSEI像もしくはBEI像を同時に観察可能	7,700円/時間
透過型電子顕微鏡室Ⅴ	原子分解能分析電子顕微鏡 (JEM-ARM200F)	加速電圧：200 kV TEM、STEM、電子回折、エネルギーフィルター、EDS、EELS	詳細はARIM事業料金表を御覧ください
FIB-SEM室	FIB-SEM (JIB-4700F)	3D-SEM、3D-EDS、3D-EBSD、OmniProbe（TEM試料 試料室内ピックアップシステム）、STEM、大気非曝露機構	29,700円/時間
	W-SEM (JSM-IT200LA)	電子銃：タングステンフィラメント、低真空圧力：10 ～ 100 Pa EDS	6,600円/時間
	CCP (IB19520CCP)	使用ガス：Ar、イオン加速電圧：2～8kV、冷却温度設定範囲：－120～0℃	6,600円/時間
X線マイクロアナライザー室	FE-EPMA (JXA-8530F)	波長分散型X線分光器（3CH） エネルギー分散形X線元素分析装置（2CH）	24,200円/時間
	FE-SEM (JSM-7001F)	エネルギー分散形X線元素分析装置付き 結晶方位解析システム	15,400円/時間
	CP (IB09020)	常温のCP クライオCPを希望される場合はFIB-SEM室のCCPをご検討ください	5,500円/時間
走査電子顕微鏡室Ⅲ	L-FE-SEM (JSM-7800F)	加速電圧：0.01～30 kV、LED, UED (UEDフィルター電圧可変機能組込み) エネルギー分散形X線元素分析装置/カソードルミネセンス分析装置付き	25,300円/時間
X線分析室	XRD (SmartLab)	X線源出力：9 kW、回転対陰極式	8,800円/時間
	XRD (SmartLab SE)	X線源出力：3 kW、封入管式	5,500円/時間
表面粗さ計室	走査型プローブ顕微鏡（SPM-9700）	コンタクトモード、ダイナミックモード、位相モード	4,400円/時間 ※カンチレバーは別途利用者負担
オージェ分析室	AES (JAMP-9500F)	二次電子分解能：3 nm (25 kV、10 pA) オージェ分析時最小プローブ径：8 nm (25 kV、1 pA)	17,600円/時間
光電子分光室	XPS (PHI Quantes)	デュアルソースX線源：Al Kα、Cr Kα 機能：ガスクラスターイオンビーム、中和銃、アルゴンスパッタ、 試料加熱室、トランスファーベッセル	詳細はARIM事業料金表を御覧ください
2次イオン質量分析室	TOF-SIMS (PHI TRIFTV nano TOF)	質量分解能（無機材料）：9,000M/Δμ以上 質量分解能（有機材料）：9,000M/Δμ以上 (PET（m/z 104）にて)	詳細はARIM事業料金表を御覧ください
電子顕微鏡試料作成室	FIB (JEM-9320FIB)	加速電圧：0.5～30 kV、ビーム電流：30 nA（30 kV） 分解能：6 nm（30 kV）、加工形状：矩形、ライン、スポット	6,600円/時間

測定室名	装置名、型式	性能・機能	装置使用料単価（税込）
化学分析・生命科学系			
核磁気共鳴室	NMR (JNM-ECZ700R)	^{1}H(プロトン)、^{13}C（カーボン）、その他多核種の測定 共鳴周波数：700 MHz	4,400円/時間 NMRチューブ：2,750円/本 重水：770円/アンプル(0.75ml) 重クロロホルム：770円/アンプル(0.75ml) 重トルエン：1,870円/アンプル(0.75ml)
	NMR (Avance 500US+Cryo)	^{1}H（プロトン）、^{13}C（カーボン）核専用 共鳴周波数：500 MHz、クライオプローブ	
	パルスNMR分光計 (ミニスペックmq)	温度範囲：-100～200℃	
固体核磁気共鳴室	NMR (JNM-ECA600II)	固体試料：測定可能、多核測定：可能、共鳴周波数：600 MHz	5,500円/時間
質量分析室	MALDI-TOFMS （JMS-S3000 SpiralTOF™-plus 2.0）	スパイラルTOF、リニアTOF、TOF/TOF	13,200円/時間
	LC/MS (CyclicIMS)	MS/MS、イオンモビリティ機能	26,400円/時間
	LC/MS (Synapt G2 HDMS)	MS/MS、イオンモビリティ機能	14,300円/時間
	元素分析装置 (vario EL cube)	CHNS元素分析 サンプル重量：～50 mg	6,600円/時間
熱分析室	TG/DTA (TG8101D)	温度範囲：RT～1300℃、雰囲気：Air、N2	5,500円/時間
	TG/DTA (TG8120)	温度範囲：RT～1300℃、雰囲気：Air、N2	4,400円/時間
	DSC (DSC8230)	温度範囲：-150～400℃、雰囲気：Air、N2	
電子スピン共鳴室	ESR (JES-RE1X)	磁場強度：0～0.65 T 温度範囲：-170～200℃ 周波数範囲：8.8～9.6 GHz	6,600円/時間
	ESR (JES-FA200)	磁場強度：0～1.3 T 温度範囲：-170～200℃（装着可：400℃、4.2 K、77 K） 周波数範囲：8.75～9.65 GHz	
赤外ラマン分光室	FT-IR (FT/IR-6300)	波数範囲：400～7800 cm^{-1} 顕微測定(IRT-5000)、真空測定、マッピング測定可能	6,600円/時間
	Raman (NRS-5500)	レーザー：3波長（532 nm, 633 nm, 785 nm） 波数範囲：50～8000 cm^{-1} マッピング測定可能	8,800円/時間
物質ダイナミックス	粘弾性測定装置 (DMS6100)	温度範囲：-150～600℃、湿度コントロール測定可能	5,500円/時間
	熱機械分析装置 (TMA/SS7100C)	温度範囲：-150～600℃	
	ダイナミックDSC (DSC8000)	温度範囲：-170～750℃	4,400円/時間
	応力制御式レオメーター (MCR-302)	ペルチェ温調システム（P-PTD） 温度範囲：-40～200℃ 対流式温度制御システム（CTD） 温度範囲：-150～450℃ 共軸二重円筒，空冷式ペルチェ温調システム温度範囲：+5～150℃ 磁気粘弾性測定，MRD，温度範囲：-100～200℃ マイクロスコープ，偏光イメージング，伸張粘度，ねじり測定	8,800円/時間
生体物質構造 分光解析室	3次元顕微蛍光寿命イメージング装置 (NF-3DFLIM-N03)	空間分解能：XY < 300 nm, Z < 700 nm (532 nm レーザー使用時) 測定可能波長範囲：400～1050 nm, 最小時間分解能：15 ps	11,000円/時間
	単結晶X線構造解析装置 (VariMax with DW RAPID)	Cu線源とMo線源に対応、出力：1.2 kW、湾曲型人工多層膜集光ミラー装備 測定温度：-180℃～室温	詳細はARIM事業料金表を御覧ください
ICP室	ICP (ICPE-9820)	高周波最大出力：1.6 kW 波長範囲：167～800 nm 分解能：≦0.005 nm at 200 nm	5,500円/時間 ※試薬は別途利用者負担
時間分解 赤外分光室	TR-FTIR (VERTEX80)	観測範囲：4000～8000 cm-1 温度範囲：10～70℃ 励起光：ナノ秒パルスレーザー（Nd:YAG）532, 355 nmおよびOPOによる波長可変（450 nm～600 nm程度）	7,700円/時間
RI室	メスバウアー分光装置	57Fe 核、119Sn 核、透過法、内部転換電子検出法、低温	詳細はARIM事業料金表を御覧ください

測定室名	装置名、型式	性能・機能	装置使用料単価（税込）
サービス系			
共同工作室 （ガラス工作室）	共同工作室 （ガラス工作室）	特注のガラス器具を作製または修理します。	4,400円/時間 ※ガラス材料は別途利用者負担
低温室	SQUID磁力計 MPMS-5P		詳細はARIM事業料金表を御覧ください
	ナノ材料物性評価ｼｽﾃﾑ PPMS		4,400円/時間
	ヘリウム液化機	持ち込まれたヘリウムを液化し、お返しします。	27,500円/時間
無響室	無響室	※通常は部屋の貸出（装置使用料）のみとなります。	3,300円/時間
小型電波暗室	小型電波暗室	※通常は部屋の貸出（装置使用料）のみとなります。 中型の電波暗室のご利用を希望の方は情報・通信系の料金表を御覧ください。	3,300円/時間

測定室名	装置名、型式	性能・機能	装置使用料単価（税込）
情報・通信系			
未来通信 研究センター	車載イーサネットパフォーマンステスター, Spirent Automotive C1	100BASE-T1対応トランシーバ×4, レイテンシーの測定解像度2.5ナノ秒, IEEE 802.1TSN対応	6,600円/時間
	EMIレシーバー, Keysight N9048B PXE	周波数レンジ:1 Hz～26.5 GHz 動作周波数レンジ:100kHz～26.5GHzのプリアンプを内蔵 タイムドメインスキャン機能、リアルタイムスキャン機能搭載	6,600円/時間
	ネットワークアナライザ, Keysight E5080B 外	周波数100kHz～44GHz、4ポート、【主なソフトウェア】100/1000BASE-T1（およびOPEN Alliance SIG TC9）リンク、ケーブル評価ソフト、【電子校正モジュール】40GHz-2ポート	7,700円/時間
	光・電気通信波形解析システム, Keysight N4377A 外	光検出器40GHz@850/1310/1550nm、バイアスティー 40MHz～ 50GHz 光パワーメータ、光減衰器、精密電流／電圧源 【主なソフトウェア構成】Sparklinghtwave（周波数応答特性測定ツール、光部品測定ツール）、アドバンスド・アイ解析ツール（PAM-4のTDECQ測定等）	12,100円/時間
	電気車載イーサネット評価システム, Keysight DSOS404A 外	本装置は100/1000BASE-T1コンプライアンステストに関する必要な機器とソフトにより構成されています。【主なハード構成】オシロスコープ(4GHz)、パルス発生器(330 MHz)／任意波形発生(500 MHz)、メディコン、高周波プローブ、汎用テストフィクスチャー、【主なソフト構成】100/1000BASE-T1規格適合試験、PAM-N解析、シグナルインテグリティ、ジッタ解析、Tx/Rx試験、ノイズビジュアライザー	7,700円/時間
	通信性能評価汎用機器, Keysight 53210A 外	RFカウンタ（350MHz）、電源、データロガー、汎用オシロスコープ（4チャンネル、350MHz）、通信インターフェース、熱電対、等の汎用装置です。各種計測システムの補助的な装置としてご利用ください。	3,300円/時間
	小型環境試験器, エスペックSH-642	温湿度範囲:　－40～＋150℃ / 30～95%rh 内寸:　W400×H400×D400 ケーブル孔:　左右にΦ25の孔を各1	4,400円/時間
	中型電波暗室	有効寸法:W5.79×L5.84 対応試験規格:CISPR25,ISO11452-2他	8,800円/時間
	シールドルーム	有効寸法:W4.0×L6.0 対応試験規格:ESD他	6,600円/時間
	BCI/TWC/DPIイミュニティ試験システム	電波暗室内でIEC62134-4に準拠したDPI(Direct Power Injection)法試験、およびISO11452-4に準拠したBCI法試験とTWC法試験を実施するためのシステム機器です。	7,700円/時間
	エミッション試験システム	電波暗室内でCISPR25に準拠した放射エミッション試験、および伝導エミッション試験を実施するためのシステム機器です。	5,500円/時間